

Дата	Время	Лектор	Тема, часов	Содержание
27.02.2019 г., среда	12 ⁰⁰ -13 ³⁰	Казанцева Наталья Васильевна	Исследование структуры материалов в ПЭМ	Анализ дефектов кристаллической решетки с помощью просвечивающей электронной микроскопии. Дислокации, дефекты упаковки, двойники.
06.03.2019 г., среда	12 ⁰⁰ -13 ³⁰	Казанцева Наталья Васильевна		Дифракция электронов в просвечивающем электронном микроскопе. Специфические эффекты на микроэлектронogramмах (двойная дифракция, запрещенные рефлексы, диффузное рассеяние).
13.03.2019 г., среда	12 ⁰⁰ -13 ³⁰	Казанцева Наталья Васильевна		Индицирование микроэлектронogramм. Ориентационные соотношения между фазами, матричный анализ. Индицирование микроэлектронogramм с рефлексами двойников.
20.03.2019 г., среда	12 ⁰⁰ -13 ³⁰	Казанцева Наталья Васильевна		Количественные данные, получаемые из электронно-микроскопических изображений. Муар. Кикучи линии.
	14 ⁰⁰ -15 ³⁰	Окулов Всеволод Игоревич		